

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

115 EDVS 3357  
PTO  
1000 U.S. 974796  
10/09/01 10/12/01  


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office

出願年月日  
Date of Application:

2000年10月19日

出願番号  
Application Number:

特願2000-319722

出願人  
Applicant(s):

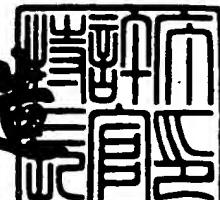
セイコーエプソン株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2001年 8月17日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕三



出証番号 出証特2001-3072983

【書類名】 特許願  
【整理番号】 EP-0274801  
【提出日】 平成12年10月19日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G06F 13/00  
【発明者】  
【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内  
【氏名】 神原 義幸  
【特許出願人】  
【識別番号】 000002369  
【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社  
【代理人】  
【識別番号】 100090479  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 井上 一  
【電話番号】 03-5397-0891  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100090387  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 布施 行夫  
【電話番号】 03-5397-0891  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100090398  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 大渕 美千栄  
【電話番号】 03-5397-0891  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 039491

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9402500

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 サンプリングクロック生成回路、データ転送制御装置及び電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 データをサンプリングするためのクロックを生成するサンプリングクロック生成回路であって、

周波数が同一で位相が互いに異なる第1～第Nのクロックのエッジの中のいずれのエッジ間にデータのエッジがあるかを検出するエッジ検出手段と、

前記エッジ検出手段でのエッジ検出情報に基づいて、前記第1～第Nのクロックの中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力するクロック選択手段と、

を含むことを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項2】 請求項1において、

前記エッジ検出手段が、

データを第1のクロックで保持する第1の保持手段と・・・データを第J（ $1 < J < N$ ）のクロックで保持する第Jの保持手段と・・・データを第Nのクロックで保持する第Nの保持手段と、

第1、第2の保持手段に保持されたデータに基づいて、第1、第2のクロックのエッジ間にデータのエッジがあるか否かを検出する第1の検出手段と・・・第J、第J+1の保持手段に保持されたデータに基づいて、第J、第J+1のクロックのエッジ間にデータのエッジがあるか否かを検出する第Jの検出手段と・・・第N、第1の保持手段に保持されたデータに基づいて、第N、第1のクロックのエッジ間にデータのエッジがあるか否かを検出する第Nの検出手段とを含み、

前記クロック選択手段が、

前記第1～第Nの検出手段でのエッジ検出情報に基づいて、前記第1～第Nのクロックの中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力することを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項3】 請求項2において、

前記第1～第Nの保持手段のセットアップタイムをT S、ホールドタイムをT H、第1～第Nのクロックの周期をTとした場合に、第1～第Nのクロックのクロック数Nを、 $N \leq [T / (T S + T H)]$ （[X]はXを越えない最大の整数）としたことを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項4】 請求項3において、

クロック数Nを、 $N = [T / (T S + T H)]$ （[X]はXを越えない最大の整数）としたことを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項5】 請求項4において、

クロック数Nを、 $N = 5$ としたことを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれかにおいて、

前記クロック選択手段が、

データのエッジから所与の設定数Mだけずれたエッジを有するクロックを第1～第Nのクロックの中から選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力することを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項7】 請求項6において、

生成されたサンプリングクロックに基づいてデータを保持する手段のセットアップタイム、ホールドタイムが確保される数に前記設定数Mが設定されていることを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項8】 データをサンプリングするためのクロックを生成するサンプリングクロック生成回路であって、

データのエッジを検出するエッジ検出手段と、

前記エッジ検出手段でのエッジ検出情報に基づいて、周波数が同一で位相が互いに異なる第1～第Nのクロックの中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力するクロック選択手段とを含み、

前記エッジ検出手段が、第1～第Nのクロックの中のいずれかのクロックでデータを保持する少なくとも1つの保持手段を含み、

前記エッジ検出手段が含む前記保持手段のセットアップタイムをT S、ホール

ドタイムをTH、第1～第Nのクロックの周期をTとした場合に、第1～第Nのクロックのクロック数Nを、 $N \leq [T / (TS + TH)]$ （[X]はXを越えない最大の整数）としたことを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項9】 請求項8において、

クロック数Nを、 $N = [T / (TS + TH)]$ （[X]はXを越えない最大の整数）としたことを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項10】 請求項9において、

クロック数Nを、 $N = 5$ としたことを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項11】 データをサンプリングするためのクロックを生成するサンプリングクロック生成回路であって、

データのエッジを検出するエッジ検出手段と、

前記エッジ検出手段でのエッジ検出情報に基づいて、周波数が同一で位相が互いに異なる第1～第Nのクロックの中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力するクロック選択手段とを含み、

前記クロック選択手段が、

データのエッジから所与の設定数Mだけずれたエッジを有するクロックを第1～第Nのクロックの中から選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力することを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項12】 請求項11において、

生成されたサンプリングクロックに基づいてデータを保持する手段のセットアップタイム、ホールドタイムが確保される数に前記設定数Mが設定されていることを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項13】 請求項1乃至12のいずれかにおいて、

発振周波数が可変に制御される発振手段を有し、発振手段により生成されるクロックをベースクロックに位同期させるPLL回路を含み、

前記発振手段が含む奇数段の第1～第Nの反転回路の出力が、前記第1～第Nのクロックとして用いられることを特徴とするサンプリングクロック生成回路。

【請求項14】 バスを介したデータ転送のためのデータ転送制御装置であ

って、

請求項1乃至13のいずれかのサンプリングクロック生成回路と、

前記サンプリングクロック生成回路で生成されたサンプリングクロックに基づいてデータを保持し、保持されたデータに基づいて、データ転送のための所与の処理を行う回路と、

を含むことを特徴とするデータ転送制御装置。

【請求項15】 請求項14において、

USB (Universal Serial Bus)の規格に準拠したデータ転送を行うことを特徴とするデータ転送制御装置。

【請求項16】 請求項14又は15のデータ転送制御装置と、

前記データ転送制御装置及び前記バスを介して転送されるデータの出力処理又は取り込み処理又は記憶処理を行う装置と、

を含むことを特徴とする電子機器。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

##### 【発明の属する技術分野】

本発明は、サンプリングクロック生成回路、データ転送制御装置及び電子機器に関し、特に、USB 2.0などの高速バスで転送されるデータのサンプリングに最適なサンプリングクロックを生成する回路、及びこのサンプリングクロック生成回路が用いられるデータ転送制御装置、電子機器に関する。

##### 【0002】

##### 【背景技術及び発明が解決しようとする課題】

近年、パーソナルコンピュータと周辺機器（広義には電子機器）とを接続するためのインターフェース規格として、USB (Universal Serial Bus)が注目を集めている。このUSBには、従来は別々の規格のコネクタで接続されていたマウスやキーボードやプリンタなどの周辺機器を、同じ規格のコネクタで接続できること共にいわゆるプラグ&プレイやホットプラグも実現できるという利点がある。

##### 【0003】

一方、このUSBには、同じくシリアルバスインターフェース規格として脚光を浴びているIEEE1394に比べて、転送速度が遅いという問題点がある。

#### 【0004】

そこで、従来のUSB1.1の規格に対する下位互換性を持ちながら、USB1.1に比べて格段に高速な480Mbps (HSモード) のデータ転送速度を実現できるUSB2.0規格が策定され、注目を浴びている。また、USB2.0の物理層回路や論理層回路のインターフェース仕様を定義したUTMI (USB2.0 Transceiver Macrocell Interface) も策定されている。

#### 【0005】

さて、このUSB2.0では、HS (High Speed) モード時には480Mbpsでデータ転送が行われるため、高速な転送速度が要求されるハードディスクドライブや光ディスクドライブなどのストレージ機器のインターフェースとして用いることができるという利点がある。

#### 【0006】

しかしながら、その一方で、USBバスに接続されるデータ転送制御装置は、480Mbpsで転送されてくるデータをサンプリングするために、480MHzという高い周波数のサンプリングクロックを生成しなければならない。しかも、データのサンプリング時におけるセットアップタイムやホールドタイムを確保できるサンプリングクロックを生成する必要がある。従って、このようなサンプリングクロックの生成回路の設計が非常に困難であるという課題がある。

#### 【0007】

この場合、微細加工が可能な最新の半導体プロセスを用いれば、このようなサンプリングクロック生成回路の実現も可能となるが、最新の半導体プロセスを使用できない場合には、このような高速動作可能なサンプリングクロック生成回路の実現は非常に困難になる。

#### 【0008】

また、最新の半導体プロセスを使用せずに高速なサンプリングクロック生成回路を実現する1つの手法として、手作業により回路を配置、配線してクロックスルーチューリングを最小化し、同期動作を保証する手法がある。

## 【0009】

しかしながら、このような手作業による回路の配置、配線は、HDL (Hardware Description Language) による回路合成や自動配置配線を利用した効率的な回路設計手法に比べて、設計期間の長期化や装置の高コスト化を招くと共に、データ転送制御装置（物理層回路、論理層回路）のマクロセル化の妨げにもなる。

## 【0010】

本発明は、以上のような技術的課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、高周波数でありながらサンプリング時におけるセットアップタイム等を確保できるサンプリングクロックの生成回路、及びこれを用いたデータ転送制御装置、電子機器を提供することにある。

## 【0011】

## 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために本発明は、データをサンプリングするためのクロックを生成するサンプリングクロック生成回路であって、周波数が同一で位相が互いに異なる第1～第Nのクロックのエッジの中のいずれのエッジ間にデータのエッジがあるかを検出するエッジ検出手段と、前記エッジ検出手段でのエッジ検出情報に基づいて、前記第1～第Nのクロックの中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力するクロック選択手段とを含むことを特徴とする。

## 【0012】

本発明によれば、多相の第1～第Nのクロックのエッジの中のいずれのエッジ間にデータのエッジがあるのかが検出される。例えば、データのエッジが、第1、第2のクロックのエッジ間にあるのか、第2、第3のクロックのエッジ間にあるのか等が検出される。そして、得られたエッジ検出情報（どのクロックのエッジ間にデータのエッジがあるのかを示す情報）に基づいて、第1～第Nのクロックの中からいずれかのクロックが選択され、そのクロックがサンプリングクロックとして出力される。

## 【0013】

このように本発明によれば、エッジ検出情報に基づいて第1～第Nのクロック

の中からクロックを選択するという簡素な構成で、データのサンプリングクロックを生成できる。従って、高速なクロックに同期して入力されるデータであっても、そのデータをサンプリングするための適正なサンプリングクロックを、小規模な回路構成で生成できるようになる。

## 【0014】

また本発明は、前記エッジ検出手段が、データを第1のクロックで保持する第1の保持手段と・・・データを第J ( $1 < J < N$ ) のクロックで保持する第Jの保持手段と・・・データを第Nのクロックで保持する第Nの保持手段と、第1、第2の保持手段に保持されたデータに基づいて、第1、第2のクロックのエッジ間にデータのエッジがあるか否かを検出する第1の検出手段と・・・第J、第J+1の保持手段に保持されたデータに基づいて、第J、第J+1のクロックのエッジ間にデータのエッジがあるか否かを検出する第Jの検出手段と・・・第N、第1の保持手段に保持されたデータに基づいて、第N、第1のクロックのエッジ間にデータのエッジがあるか否かを検出する第Nの検出手段とを含み、前記クロック選択手段が、前記第1～第Nの検出手段でのエッジ検出情報に基づいて、前記第1～第Nのクロックの中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力することを特徴とする。このようにすれば、第1～第Nの保持手段と第1～第Nの検出手段を設けるだけという簡素な構成で、どのクロックのエッジ間にデータのエッジがあるのかを検出できるようになる。

## 【0015】

また本発明は、前記第1～第Nの保持手段のセットアップタイムをT<sub>S</sub>、ホールドタイムをT<sub>H</sub>、第1～第Nのクロックの周期をTとした場合に、第1～第Nのクロックのクロック数Nを、 $N \leq [T / (T_S + T_H)]$  ([X] はXを越えない最大の整数) としたことを特徴とする。このようにすれば、第1～第Nの保持手段で保持されるデータが不定になった場合にも、適正なエッジ検出情報を得ることが可能になる。

## 【0016】

また本発明は、クロック数Nを、 $N = [T / (T_S + T_H)]$  ([X] はXを

越えない最大の整数)としたことを特徴とする。このようにすれば、適正なエッジ検出情報を得ることができるクロック数Nの範囲内で、Nを最大の数にすることができる、クロック選択手段で選択できるクロックの選択枝の範囲を広めることができる。

#### 【0017】

また本発明は、クロック数Nを、N=5としたことを特徴とする。このようにN=5とすれば、データのエッジから例えば2~4個ずれたエッジを持つクロックをサンプリングクロックとして選択できるようになり、クロックの選択枝として十分な範囲の選択枝を確保できるようになる。また、第1~第N(=5)のクロックを、PLL回路の発振手段が有する反転回路の出力から得る場合には、反転回路の段数を5段にすることができ、高い周波数でPLL回路の発振手段を発振させることができる。この結果、高周波数のサンプリングクロックを得ることが可能になる。

#### 【0018】

また本発明は、前記クロック選択手段が、データのエッジから所与の設定数Mだけずれたエッジを有するクロックを第1~第Nのクロックの中から選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力することを特徴とする。このようにすれば、後段の回路がサンプリングクロック生成回路で生成されたサンプリングクロックを直接に用いないでデータをサンプリングするような場合にも、後段の回路の構成に応じた適正なサンプリングクロックを後段の回路に提供できるようになる。

#### 【0019】

また本発明は、生成されたサンプリングクロックに基づいてデータを保持する手段のセットアップタイム、ホールドタイムが確保される数に前記設定数Mが設定されていることを特徴とする。このようにすれば、後段の回路でのデータのサンプリングエラーを防止できるようになり、信頼性を向上できる。

#### 【0020】

また本発明は、データをサンプリングするためのクロックを生成するサンプリングクロック生成回路であって、データのエッジを検出するエッジ検出手段と、

前記エッジ検出手段でのエッジ検出情報に基づいて、周波数が同一で位相が互いに異なる第1～第Nのクロックの中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力するクロック選択手段とを含み、前記エッジ検出手段が、第1～第Nのクロックの中のいずれかのクロックでデータを保持する少なくとも1つの保持手段を含み、前記エッジ検出手段が含む前記保持手段のセットアップタイムをT<sub>S</sub>、ホールドタイムをT<sub>H</sub>、第1～第Nのクロックの周期をTとした場合に、第1～第Nのクロックのクロック数Nを、 $N \leq [T / (T_S + T_H)]$ （[X]はXを越えない最大の整数）としたことを特徴とする。

#### 【0021】

本発明によれば、保持手段で保持されるデータが不定になった場合にも、適正なエッジ検出情報を得ることが可能になり、適正なサンプリングクロックを生成できるようになる。

#### 【0022】

また本発明は、データをサンプリングするためのクロックを生成するサンプリングクロック生成回路であって、データのエッジを検出するエッジ検出手段と、前記エッジ検出手段でのエッジ検出情報に基づいて、周波数が同一で位相が互いに異なる第1～第Nのクロックの中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力するクロック選択手段とを含み、前記クロック選択手段が、データのエッジから所与の設定数Mだけずれたエッジを有するクロックを第1～第Nのクロックの中から選択し、選択したクロックをサンプリングクロックとして出力することを特徴とする。

#### 【0023】

本発明によれば、Nの設定を異ならせることで、後段の回路の構成に応じた適正なサンプリングクロックを生成し、後段の回路に提供できるようになる。

#### 【0024】

また本発明は、発振周波数が可変に制御される発振手段を有し、発振手段により生成されるクロックをベースクロックに位相同期させるPLL回路を含み、前記発振手段が含む奇数段の第1～第Nの反転回路の出力が、前記第1～第Nのク

ロックとして用いられることを特徴とする。このようにすれば、第1～第Nのクロックを生成するために新たに別の回路を設ける必要がなくなり、回路の小規模化を図れる。

#### 【0025】

また本発明は、バスを介したデータ転送のためのデータ転送制御装置であって、上記のいずれかのサンプリングクロック生成回路と、前記サンプリングクロック生成回路で生成されたサンプリングクロックに基づいてデータを保持し、保持されたデータに基づいて、データ転送のための所与の処理を行う回路とを含むことを特徴とする。

#### 【0026】

本発明によれば、バスを介して転送されるデータを確実にサンプリングできるサンプリングクロックを生成できるようになるため、データ転送の信頼性を高めることができる。また、高速な転送速度で転送されるデータも確実にサンプリングできるようになるため、高速バスの規格にも対応できるデータ転送制御装置を実現できる。

#### 【0027】

また本発明は、USB (Universal Serial Bus)の規格に準拠したデータ転送を行うことを特徴とする。このようにすれば、例えばUSB 2.0で規格化されたHSモードでのデータ転送等についても適正に実現できるようになる。

#### 【0028】

また本発明に係る電子機器は、上記のいずれかのデータ転送制御装置と、前記データ転送制御装置及び前記バスを介して転送されるデータの出力処理又は取り込み処理又は記憶処理を行う装置とを含むことを特徴とする。

#### 【0029】

本発明によれば、電子機器に使用されるデータ転送制御装置の低コスト化、信頼性の向上を図れるため、電子機器の低コスト化、信頼性の向上も図れるようになる。また、本発明によれば、高速な転送モードでデータ転送を行うことができるようになるため、電子機器の処理の高速化を図れるようになる。

#### 【0030】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の好適な実施形態について図面を用いて詳細に説明する。

## 【0031】

## 1. 構成及び動作

## 1. 1 データ転送制御装置

図1に本実施形態のデータ転送制御装置の構成の例を示す。

## 【0032】

本実施形態のデータ転送制御装置は、データハンドラ回路400、HS (High Speed) 回路410、FS (Full Speed) 回路420、アナログフロントエンド回路430、クロック生成回路440、クロック制御回路450を含む。なお、本発明のデータ転送制御装置は、図1に示す回路ブロックの全てを含む必要はなく、それらの一部を省略する構成としてもよい。

## 【0033】

データハンドラ回路400（広義にはデータ転送を行うための所与の回路）は、USB等に準拠したデータ転送のための種々の処理を行う。より具体的には、送信時には、送信データにSYNC (synchronization)、SOP (Start Of Packet)、EOP (End Of Packet) を付加する処理や、ビットスタッフィング処理などを行う。一方、受信時には、受信データのSYNC、SOP、EOPを検出／削除する処理や、ビットアンスタッフィング処理などを行う。更に、データの送受信を制御するための各種のタイミング信号を生成する処理も行う。

## 【0034】

なお、受信データはデータハンドラ回路400から後段の回路であるSIE (Serial Interface Engine) に出力され、送信データはSIEからデータハンドラ回路400に入力されることになる。

## 【0035】

HS回路410は、データ転送速度が480MbpsとなるHS (High Speed) でのデータの送受信を行うためのロジック回路であり、FS回路420は、データ転送速度が12MbpsとなるFS (Full Speed) でのデータの送受信を行うためのロジック回路である。

## 【0036】

ここで、HSモードは、USB2.0により新たに定義された転送モードである。一方、FSモードは、従来のUSB1.1で既に定義されている転送モードである。

## 【0037】

USB2.0では、このようなHSモードが用意されているため、プリンタ、オーディオ、カメラなどにおけるデータ転送のみならず、ハードディスクドライブや光ディスクドライブ(CDROM、DVD)などのストレージ機器におけるデータ転送も実現できるようになる。

## 【0038】

HS回路410は、HSDL(L(High Speed Delay Line PLL)回路10、エラスティシティバッファ(elasticity buffer)12を含む。

## 【0039】

ここでHSDL回路10は、受信データとクロック生成回路440(PLL)からのクロックとに基づいて、データのサンプリングクロックを生成する回路である。

## 【0040】

またエラスティシティバッファ12は、内部装置(データ転送制御装置)と外部装置(バスに接続される外部装置)とのクロック周波数差(クロックドリフト)等を吸収するための回路である。

## 【0041】

アナログフロントエンド回路430は、FSやHSでの送受信を行うためのドライバやレシーバを含むアナログ回路である。USBではDP(Data+)とDM(Data-)を用いた差動信号によりデータを送受信する。

## 【0042】

クロック生成回路440は、装置内部で使用する480MHzのクロックや、装置内部及びSIEで使用する60MHzのクロックを生成する。

## 【0043】

クロック生成回路440は、発振回路20、HSPLL22、FSPLL24

を含む。

#### 【0044】

ここで発振回路20は、例えば外部振動子との組み合わせによりベースクロックを生成する。

#### 【0045】

H S P L L (HS Phase Locked Loop) 22は、発振回路20で生成されたベースクロックに基づいて、HSモードで必要な480MHzのクロックと、FSモード、装置内部及びSIEで必要な60MHzのクロックを生成するPLLである。なお、HSモードで送受信を行う場合には、このH S P L L 2 2によるクロック生成を有効にする必要がある。

#### 【0046】

F S P L L (FS Phase Locked Loop) 24は、発振回路20で生成されたベースクロックに基づいて、FSモード、装置内部及びSIEで必要な60MHzのクロックを生成する。なお、このF S P L L 2 4によるクロック生成を有効にしている時には、HSモードでの送受信は不可となる。

#### 【0047】

クロック制御回路450は、SIEからの各種の制御信号を受け、クロック生成回路440を制御する処理などを行う。なお、クロック生成回路440により生成された60MHzのシステムクロックはクロック制御回路450を介してSIEに出力される。

#### 【0048】

##### 1. 2 サンプリングクロック生成回路

図2に、本実施形態のサンプリングクロック生成回路(HSDL L回路)の構成例を示す。

#### 【0049】

H S P L L 2 2は、周波数が同一で位相が互いに異なるクロックCLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4(広義には第1～第Nのクロック)を出力する。より具体的には、H S P L L 2 2のVCO(発振周波数が可変に制御される発振手段)が含む5個の差動出力コンパレータ(広義には奇数段の第1～第

Nの反転回路) の出力が、クロックCLK0~4として用いられることになる。

#### 【0050】

HSDL回路10はエッジ検出回路70、クロック選択回路72を含む。そして、このエッジ検出回路70(エッジ検出手段)は、図1のアナログフロントエンド回路430から入力されるデータDINのエッジを検出し、そのエッジ検出情報をクロック選択回路72に出力する。

#### 【0051】

より具体的には、HSPLL22からのCLK0~4のエッジ(立ち上がり又は立ち下がりエッジ)の中のいずれのエッジ間にデータDINのエッジがあるかを検出し、そのエッジ検出情報をクロック選択回路72に出力する。

#### 【0052】

すると、クロック選択回路72は、このエッジ検出情報に基づいて、クロックCLK0~4の中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックSCLKとして後段のエラスティシティバッファ12(図1参照)に出力する。

#### 【0053】

図3(A)、(B)に本実施形態の動作を説明するためのタイミング波形図を示す。

#### 【0054】

図3(A)、(B)に示すように、CLK0~4は周波数が同一の480MHzとなるクロックである。また、クロックの周期をTとした場合に、各クロック間の位相がT/5(広義にはT/N)だけシフトしている。

#### 【0055】

そして図3(A)では、サンプリング対象となるデータDINのエッジEDが、クロックCLK0とCLK1の間にあることが図2のエッジ検出回路70により検出される。すると、データDINのエッジEDから例えば3個(広義には設定数M個)だけずれたエッジEC3を有するクロックCLK3が図2のクロック選択回路72により選択され、この選択されたCLK3が、DINのサンプリングクロックSCLKとして後段の回路(エラスティシティバッファ12)に出力

される。

#### 【0056】

一方、図3（B）では、DINのエッジEDが、CLK2とCLK3の間にあることがエッジ検出回路70により検出される。すると、DINのエッジEDから例えば3個（広義には設定数M個）だけずれたエッジEC0を有するクロックCLK0がクロック選択回路72により選択され、この選択されたCLK0が、DINのサンプリングクロックSCLKとして後段の回路（エラスティシティバッファ12）に出力される。

#### 【0057】

このように本実施形態によれば、データDINのエッジEDを検出し、得られたエッジ検出情報に基づいてCLK0～CLK4からクロックを選択するという簡素な構成で、データDINのサンプリングクロックSCLKを生成できる。従って、USB2.0のHSモードのように、DINが外部装置の480MHzに同期する高速な転送データである場合にも、このDINを適正にサンプリングできるクロックSCLKを生成できる。

#### 【0058】

また本実施形態によれば、図3（A）、（B）に示すように、生成されたサンプリングクロックSCLKのエッジESをDINのエッジ間の真ん中付近に位置させることができる。従って、後段の回路（エラスティシティバッファ12）は、データの保持のためのセットアップタイムやホールドタイムを十分に確保できるようになり、データ受信の信頼性を格段に高めることができる。

#### 【0059】

また本実施形態によれば、DINのエッジ検出やSCLKの生成のために使用する5相（多相）のクロックCLK0～4として、HSPLL22のVCOが含む差動出力コンパレータ（反転回路）の出力を有効利用している。従って、CLK0～4を生成するために別の新たな回路を設ける必要が無いため、回路の小規模化を図れる。

#### 【0060】

##### 1. 3 HSPLLの詳細例

図4にH S P L L 2 2の詳細な構成例を示す。

#### 【0061】

このH S P L L 2 2は、位相比較器80、チャージポンプ回路82、フィルタ回路84、VCO (Voltage Controlled Oscillator) 86、分周器88などを含む。

#### 【0062】

ここで位相比較器80は、ベースクロックRCLK (例えば12~24MHz)と分周器88からのクロックDCLK4の位相を比較し、位相誤差信号PUP、PDWを出力する (PUPは位相進み信号、PDWは位相遅れ信号)。

#### 【0063】

チャージポンプ回路82は、位相比較器80からのPUP、PDWに基づいてチャージポンプ動作を行う。より具体的には、PUPがアクティブになると、フィルタ回路84が含むコンデンサを充電する動作を行い、PDWがアクティブになると、コンデンサを放電する動作を行う。そして、フィルタ回路84により平滑化された制御電圧VCがVCO86に与えられる。

#### 【0064】

VCO86は、制御電圧VCに応じてその発振周波数が可変に制御される発振動作を行い、480MHzのクロックQCLK0~4を生成する。例えば、制御電圧VCが高くなると発振周波数も高くなり、制御電圧VCが低くなると発振周波数も低くなる。

#### 【0065】

VCO86により生成されたクロックQCLK0~4は、バッファBF00~04、BF10~14を介してCLK0~4として外部に出力される。なお、BF20~23はBF24との負荷合わせのためのダミーのバッファである。

#### 【0066】

分周器88は、バッファBF04、BF24を介してVCO86から入力されるクロックQCLK4を分周 (1/N) して、分周後のクロックDCLK4を位相比較器80に出力する。

#### 【0067】

図4の構成のH S P L L 2 2によれば、ベースクロックR C L Kに位相同期した高周波数の4 8 0 M H zのクロックC L K 4 (C L K 0 ~ 3)を生成できるようになる。

## 【0068】

図5に、V C O 8 6の構成例を示す。

## 【0069】

このV C O 8 6は、5段（広義には奇数段）のシリアル接続された差動出力コンパレータD C P 0 ~ 4（反転回路）を含み、各D C P 0 ~ 4の差動出力X Q、Qは、シングルエンド出力コンパレータS C P 0 ~ 4の差動入力に入力される。そして、S C P 0 ~ 4の出力がV C O 8 6の出力クロックQ C L K 0 ~ 4になる。また、制御電圧V Cが変化すると、差動出力コンパレータD C P 0 ~ 4の電流源に流れる電流が変化し、発振周波数が変化する。

## 【0070】

図6（A）に差動出力コンパレータ（差動増幅器）D C P 0 ~ 4の構成例を示す。この差動出力コンパレータは、差動入力I、X Iがゲート電極に接続され、差動出力X Q、Qがドレイン電極に接続されたN型トランジスタN T 1、N T 2と、差動出力Qがゲート電極に接続され、差動出力X Q、Qがドレイン電極に接続されたP型トランジスタP T 1、P T 2と、制御電圧V Cがゲート電極に接続されたN型トランジスタN T 3（電流源）を含む。

## 【0071】

本実施形態では、図5の5段の差動出力コンパレータD C P 0 ~ 4（反転回路）の出力を利用して、図2、図3（A）、（B）で説明した5相のクロックC L K 0 ~ C L K 4を得ている。そして、これらの差動出力コンパレータD C P 0 ~ 4は、V C O 8 6の発振動作のために元々必要な回路である。従って、このように差動出力コンパレータD C P 0 ~ 4の出力を5相のクロックC L K 0 ~ C L K 4として利用するようにすれば、C L K 0 ~ 4を生成するために別の新たな回路を設ける必要がなくなるため、回路の小規模化を図れる。

## 【0072】

なお図4のH S P L L 2 2において、チャージポンプ回路8 2を設けない構成

としてもよい。また、VCO86の代わりに電流制御の発振手段を設けるようにしてもよい。

## 【0073】

また、VCO86に含ませる反転回路は図6(A)に示す差動出力コンパレータに限定されず、種々の変形実施が可能である。例えば図6(B)に示す反転回路では、P型トランジスタPT4、PT5、N型トランジスタNT4、NT5が直列接続される。そして、これらのトランジスタに流れる電流が、PT4、NT5のゲート電極に接続される制御電圧VCQ、VCにより制御されて、発振周波数が可変に制御される。

## 【0074】

## 1.4 エッジ検出回路、クロック選択回路の詳細例

図7にエッジ検出回路70、クロック選択回路72の詳細な構成例を示す。

## 【0075】

エッジ検出回路70は、DフリップフロップDFA0と、DフリップフロップDFB0～DFB4（第1～第Nの保持手段）と、検出回路EDET0～EDET4（第1～第Nの検出手段）を含む。

## 【0076】

ここで、DフリップフロップDFA0は、信号SQUELCHをデータDINのエッジでサンプリングして保持し、信号SSQUELCHを出力する。

## 【0077】

DフリップフロップDFB0（第1の保持手段）は、データDINをクロックCLK0のエッジでサンプリングして保持する。同様に、DFB1（第2の保持手段）はDINをCLK1で保持し、DFB2（第3の保持手段）はDINをCLK2で保持し、DFB3（第4の保持手段）はDINをCLK3で保持し、DFB4（第5の保持手段）はDINをCLK4で保持する。

## 【0078】

そして検出回路EDET0～4は、DフリップフロップDFB0～DFB4の出力DQ0～DQ4（保持されたデータ）に基づいて排他的論理和演算を行い、クロックCLK0～CLK4のエッジの中のいずれのエッジ間にデータDINの

エッジがあるかを検出する。

#### 【0079】

より具体的には、検出回路EDET0（第1の検出手段）は、DフリップフロップDFB0、1の出力DQ0、1に基づいて、クロックCLK0、1のエッジ間にデータDINのエッジがあるか否かを検出する。同様に、EDET1（第2の検出手段）は、DFB1、2の出力DQ1、2に基づいて、CLK1、2のエッジ間にDINのエッジがあるか否かを検出する。またEDET2（第3の検出手段）は、DFB2、3の出力DQ2、3に基づいて、CLK2、3のエッジ間にDINのエッジがあるか否かを検出する。またEDET3（第4の検出手段）は、DFB3、4の出力DQ3、4に基づいて、CLK3、4のエッジ間にDINのエッジがあるか否かを検出する。またEDET4（第5の検出手段）は、DFB4、0の出力DQ4、0に基づいて、CLK4、0のエッジ間にDINのエッジがあるか否かを検出する。

#### 【0080】

そして、クロック選択回路72（クロック選択手段）は、検出回路EDET0～4の出力EQ0～4（エッジ検出情報）に基づいて、CLK0～4のクロックの中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックSCLKとして出力する。

#### 【0081】

図8、図9に本実施形態の動作を説明するためのタイミング波形図を示す。

#### 【0082】

受信したデータDINがノイズか否かを判別するための信号SQUELCHが図8のA1に示すように「1」（論理レベル。以下同様）になると、これがDINの立ち下がりエッジで図7のDフリップフロップDFA0に保持され、A2に示すようにSSQUELCHも「1」になる。そしてSSQUELCHが「1」になるとエッジ検出回路70のエッジ検出動作がイネーブルされる。

#### 【0083】

すると、DフリップフロップDFB0～4がCLK0～4の立ち上がりエッジでデータDINを保持し、図9のB1に示すようなDQ0～4を出力する。そし

て、検出回路EDET0はDQ0、1の例えは排他的論理和演算を行いB2に示すようなEQ0を出力する。同様に、検出回路EDET1、2、3、4は、各々、DQ1、2、DQ2、3、DQ3、4、DQ4、0の排他的論理和演算を行いB3～6に示すようなEQ1～4を出力する。

## 【0084】

クロック選択回路72は、これらの出力EQ0～4に基づいてクロックCLK0～4のいずれを選択するかを判断する。例えば図9のB2ではクロックCLK0、1のエッジ間にデータのエッジがあることが検出されたため、DINのエッジから例えは3個（所与の設定数M）だけずれたエッジを有するCLK4を選択し（図3（A）参照）、サンプリングクロックSCLKとして出力する。

## 【0085】

このクロックの選択は、クロック選択回路72が有する図示しない組み合わせ回路が、図8に示すようなクロック選択信号CSEL0～4を生成し、これらのCSEL0～4とCLK0～4との論理積演算を行うことで実現できる。

## 【0086】

例えは図8のA3ではクロック選択信号CSEL3がアクティブ（「1」）になっているため、クロックCLK3が選択されてサンプリングクロックSCLKとして出力される。同様に、A4、A5ではCSEL2、1がアクティブになっているため、各々、CLK2、1が選択されてSCLKとして出力される。

## 【0087】

なお、クロック選択回路72によるクロックの選択動作は、HSPLL22の位相同期がロックされたことを示す信号PLLLOCKEDが図8のA6に示すようにアクティブになったことを条件として、イネーブルされる。

## 【0088】

## 1.5 セットアップタイム、ホールドタイムの確保

さて、図7のDフリップフロップ（保持手段）DFB0～4が、図10に示すようなタイミングでCLK0～CLK4を用いてデータDINを保持した場合を考える。

## 【0089】

この場合に、図10のC1では、データDINのエッジEDとCLK1のエッジEC1とが近いため、CLK1でDINを保持するDフリップフロップDFB1（図7参照）のセットアップタイムTSが足りなくなる。従って図10のC2に示すように、保持されるデータが不定となり、「0」又は「1」のいずれなのかを確定できなくなる。

## 【0090】

しかしながら、このような場合にも本実施形態では、図10のC3、C4に示すように、DINのエッジED（EDが検出されたと想定される位置）から例えば3個（M個）だけずれたエッジを持つクロックをサンプリングクロックSCLKとして選択しているため、適切なSCLKを生成できる。即ち、図10のC3に示すようにCLK3がSCLKとして選択された場合にも、C4に示すようにCLK4がSCLKとして選択された場合にも、SCLKの取り込みエッジをDINのエッジ間の真ん中付近に位置させることができる。従って、後段の回路（エラスティシティバッファ）は、この生成されたSCLKを用いてDINを適正にサンプリングして保持できる。

## 【0091】

ところで図10では、多相クロックCLK0～N（CLK0～4）の周期をT、クロック数をN（=5）、Dフリップフロップ（保持手段）のセットアップタイムをTS、ホールドタイムをTHとした場合に、

$$T/N > TS + TH \quad (1)$$

の式が成立している。上式（1）を変形すると、

$$N < T / (TS + TH) \quad (2)$$

或いは、

$$N \leq [T / (TS + TH)] \quad (3)$$

となる。なお、上式（3）において[X]はXを越えない最大の整数である。

## 【0092】

例えば、 $T = 2.08 \text{ n s}$ （nanosecond）、 $TS = TP = 0.4 \text{ n s}$ であると想定した場合には、 $N \leq 5$ になる。即ち、この場合には、多相クロックの数を $N \leq 5$ にすれば、多相クロック間のセットアップタイムとホールドタイムとが重な

り合わないようになる。

#### 【0093】

一方、図11(A)では、多相クロックCLK0~6の数が図10よりも増えしており、7個になっている。即ち、HSPLL22(図2参照)が内蔵する反転回路(差動出力コンパレータ)の出力を多相クロックとして利用する場合には、VCOを負帰還(リングオシレータ)で発振させるために反転回路の段数は奇数になり、多相クロックの数も奇数になる。従って、多相クロックの数を5個よりも大きな数にする場合には、その数は7個になる。

#### 【0094】

そして図11(A)のように、7個の多相クロックCLK0~6を用いた場合には、上記(1)、(2)、(3)の関係式が満たされなくなる可能性がある。

#### 【0095】

例えば図11(A)のD1では、DINのエッジEDとCLK0のエッジEC0とが近いため、CLK0でDINを保持するDフリップフロップDFB0(図7参照)のホールドタイムTHが足りなくなる。従って、D2に示すように、保持されるデータが不定となり、「0」又は「1」のいずれなのかを確定できなくなる。

#### 【0096】

同様に図11(A)のD3でも、DINのエッジEDとCLK1のエッジEC1とが近いため、CLK1でDINを保持するDFB1のセットアップタイムTSが足りなくなる。従って、D4に示すように、保持されるデータが不定となり、「0」又は「1」のいずれなのかを確定できなくなる。

#### 【0097】

そして、このように「不定」となるポイントが2つになってしまふと、サンプリングクロックSCLKとなる適正なクロックを選択できなくなる。即ち、図10では、DINのエッジEDから例えば3個だけずれたエッジを持つクロックをSCLKとして選択していたが、図11(A)の場合にはこのような選択手法を採用しても適切なSCLKを得ることができない。

#### 【0098】

従って、このような事態を防ぐために、多相クロックの数Nは、 $N \leq [T / (T_S + T_H)]$  の関係式を満たすものであることが望ましい。

#### 【0099】

一方、多相クロックの数を5個よりも少なくして3個（5の次の奇数）にした場合には、図11（B）に示すようになる。

#### 【0100】

この場合、DINのエッジEDから例えば2個だけずれたエッジを持つクロックをSCLKとして選択すれば、図11（B）のE1ではCLK2が選択され、E2ではCLK0が選択されることになる。

#### 【0101】

しかしながら、図11（B）では、DINのエッジEDから2個だけずれたエッジを持つクロックしか選択できず、3個或いは4個ずれたエッジを持つクロックを選択することはできない。従って、選択できるクロックの選択枝の範囲が狭いという欠点がある。

#### 【0102】

これに対して図10では、DINのエッジEDから2～4個ずれたエッジを持つクロックの選択が可能であるため、選択できるクロックの選択枝の範囲が広くなるという利点がある。

#### 【0103】

従って、クロックの選択枝の範囲を広くするためには、多相クロックの数Nは、 $N \leq [T / (T_S + T_H)]$ （[X]はXを越えない最大の整数）の関係式を満たしながら、その中で最も大きな数であることが望ましい。即ち、 $N = [T / (T_S + T_H)]$ であることが望ましい。

#### 【0104】

なお、図2のHPLL22が含む反転回路（差動出力コンパレータ）の段数が増えると、高い発振周波数を確保できないという問題がある。従って、HPLL22の反転回路の出力を多相クロックCLK0～Nとして利用する場合には、高い発振周波数を確保できる範囲でクロック数Nを大きな数にすることが望まれる。

## 【0105】

## 1. 6 クロックの選択

さて、本実施形態のサンプリングクロック生成回路で生成されたサンプリングクロック SCLK を直接に用いてデータ DIN をサンプリングする場合には、図 12 (A) に示すように、DIN のエッジ間の真ん中付近にエッジが位置するクロックを SCLK として選択することが望ましい。

## 【0106】

例えば図 12 (A) のように 5 相のクロック CLK0 ~ 4 を用いる場合には、データ DIN のエッジ ED から 3 個 (設定数 M) だけずれたエッジを有するクロック CLK3 をサンプリングクロック SCLK として選択する。

## 【0107】

このようにすれば、後段の回路がサンプリングクロック SCLK を用いてデータ DIN を保持する際に、十分なセットアップタイム、ホールドタイムを確保できるようになる。

## 【0108】

しかしながら、後段の回路が、サンプリングクロック生成回路からのサンプリングクロック SCLK を直接には用いずに、SCLK に論理演算等を施した後のクロックである SCLK' を用いてデータ DIN を保持する場合がある。

## 【0109】

このような場合には図 12 (B) に示すように、SCLK に施される論理演算を原因とする素子遅延により、SCLK' のエッジ ES' の位置が SCLK のエッジ ES の位置よりも遅延する場合がある。

## 【0110】

従って、このような場合には図 12 (B) に示すように、信号遅延を考慮して、データ DIN のエッジ ED から例えば 2 個だけずれたエッジを有するクロック CLK2 を SCLK として選択するようにする。そして、後段の回路は、この SCLK に論理演算等を施した後のクロックである SCLK' を用いてデータ DIN を保持する。このようにすれば、後段の回路は、DIN を保持する際に、十分なセットアップタイム、ホールドタイムを確保できるようになる。

## 【0111】

このように、DINのエッジEDからずらす個数Mは、後段の回路の構成に応じて可変に設定できることが望ましい。

## 【0112】

なお、SCLK'によりデータDINを適正にサンプリングできるように、DINの方を遅延素子により遅延させて後段の回路に出力するようにしてもよい。

## 【0113】

図13に後段の回路であるエラスティシティバッファ12の構成例を示す。なお、エラスティシティバッファ12は、図1のHS回路410に含まれる回路であり、判断回路60、バッファ64、セレクタ66は図1の例えばデータハンドラ回路400に含まれる回路である。

## 【0114】

エラスティシティバッファ12は、データ保持レジスタ50（データ保持手段）、データステータスレジスタ52（データステータス保持手段）、書き込みパルス生成回路54（書き込みパルス生成手段）を含む。

## 【0115】

ここでデータ保持（ホールド）レジスタ50は、シリアルデータDINを受け、これを保持する32ビット幅のレジスタである。

## 【0116】

データステータスレジスタ52は、データ保持レジスタ50の各ビットのデータのステータスを保持する32ビット幅のレジスタである。

## 【0117】

書き込みパルス生成回路54は、32ビット幅の書き込みパルス信号WP[0:31]を生成し、データ保持レジスタ50、データステータスレジスタ52に出力する回路である。

## 【0118】

ここで、書き込みパルス信号WP[0:31]は、その各パルスが、サンプリングクロックSCLKの32クロックサイクル毎（広義にはKクロックサイクル毎）に周期的にアクティブになると共に、各パルスがアクティブになる期間が1

クロックサイクルずつ互いにずれている信号である。データ保持レジスタ50は、この書き込みパルス信号WP[0:31]に基づいて、各ビットのデータを保持する。同様にデータステータスレジスタ52も、この書き込みパルス信号WP[0:31]に基づいて、各ビットのデータのステータスを保持する。

#### 【0119】

判断回路60（判断手段）は、データ保持レジスタ50に保持されるデータが有効（valid）か否かを、複数のビット（例えば8ビット）で構成されるデータセル単位で判断する回路であり、内蔵するステートマシーン62に従って動作する。

#### 【0120】

より具体的には、判断回路60は、データ保持レジスタ50の各データセルが有効か否かを示す4ビット幅の信号VALID[0:3]や、データ保持レジスタ50のオーバフロー時にアクティブになる信号OVERFLOWを、データステータスレジスタ52から受ける。

#### 【0121】

そして、各データセルが有効か否かを判断し、有効なデータセルを選択するための信号SELをセレクタ66に出力する。また、データステータスレジスタ52に保持されているデータステータスを、データセル単位でクリアするための信号STRB[0:3]をデータステータスレジスタ52に出力する。更に、HSモードでのパケット受信終了時にアクティブになる信号TERMやHSモードでの受信動作をイネーブルにする信号HSENをエラスティシティバッファ12に出力する。

#### 【0122】

バッファ64は、データ保持レジスタ50からの32ビット幅のパラレルデータDPA[0:31]を受け、60MHzのクロックPCLKで同期化しバッファリングしたデータDBUF[0:31]をセレクタ66に出力する。

#### 【0123】

セレクタ66（出力手段）は、判断回路60からの信号SELに基づいて、バッファ64からのデータDBUF[0:31]から、有効なデータセルのデータ

を選択し、8ビット幅のデータDOUT[0:7]として出力する。

#### 【0124】

図13のエラスティシティバッファ12では、データ保持レジスタ50でのデータの保持に、サンプリングクロック生成回路からのSCLKではなく、書き込みパルス生成回路54からの書き込みパルス信号WP[0:31]を用いている。即ち、SCLKに論理演算等を施して生成されたWP[0:31]を用いてデータを保持している。従って、図12(A)、(B)で説明したように、書き込みパルス生成回路54での素子遅延を考慮して設定数Mを決め、クロックを選択することが望ましい。

#### 【0125】

### 2. 電子機器

次に、本実施形態のデータ転送制御装置を含む電子機器の例について説明する

#### 【0126】

例えば図14(A)に電子機器の1つであるプリンタの内部ブロック図を示し、図15(A)にその外観図を示す。CPU(マイクロコンピュータ)510はシステム全体の制御などを行う。操作部511はプリンタをユーザが操作するためのものである。ROM516には、制御プログラム、フォントなどが格納され、RAM517はCPU510のワーク領域として機能する。DMAC518は、CPU510を介さずにデータ転送を行うためのDMAコントローラである。表示パネル519はプリンタの動作状態をユーザに知らせるためのものである。

#### 【0127】

USBを介してパーソナルコンピュータなどの他のデバイスから送られてきたシリアルの印字データは、データ転送制御装置500によりパラレルの印字データに変換される。そして、変換後のパラレル印字データは、CPU510又はDMAC518により、印字処理部(プリンタエンジン)512に送られる。そして、印字処理部512においてパラレル印字データに対して所与の処理が施され、プリントヘッダなどからなる印字部(データの出力処理を行う装置)514により紙に印字されて出力される。

## 【0128】

図14（B）に電子機器の1つであるスキヤナの内部ブロック図を示し、図15（B）にその外観図を示す。CPU520はシステム全体の制御などを行う。操作部521はスキヤナをユーザが操作するためのものである。ROM526には制御プログラムなどが格納され、RAM527はCPU520のワーク領域として機能する。DMAC528はDMAコントローラである。

## 【0129】

光源、光電変換器などからなる画像読み取り部（データの取り込み処理を行う装置）522により原稿の画像が読み取られ、読み取られた画像のデータは画像処理部（スキヤナエンジン）524により処理される。そして、処理後の画像データは、CPU520又はDMAC528によりデータ転送制御装置500に送られる。データ転送制御装置500は、このパラレルの画像データをシリアルデータに変換し、USBを介してパーソナルコンピュータなどの他のデバイスに送信する。

## 【0130】

図14（C）に電子機器の1つであるCD-RWドライブの内部ブロック図を示し、図15（C）にその外観図を示す。CPU530はシステム全体の制御などを行う。操作部531はCD-RWをユーザが操作するためのものである。ROM536には制御プログラムなどが格納され、RAM537はCPU530のワーク領域として機能する。DMAC538はDMAコントローラである。

## 【0131】

レーザ、モータ、光学系などからなる読み取り&書き込み部（データの取り込み処理を行う装置又はデータの記憶処理を行うための装置）533によりCD-RW532から読み取られたデータは、信号処理部534に入力され、エラー訂正処理などの所与の信号処理が施される。そして、信号処理が施されたデータが、CPU530又はDMAC538によりデータ転送制御装置500に送られる。データ転送制御装置500は、このパラレルのデータをシリアルデータに変換し、USBを介してパーソナルコンピュータなどの他のデバイスに送信する。

## 【0132】

一方、USBを介して他のデバイスから送られてきたシリアルのデータは、データ転送制御装置500によりパラレルのデータに変換される。そして、このパラレルデータは、CPU530又はDMAC538により信号処理部534に送られる。そして、信号処理部534においてこのパラレルデータに対して所与の信号処理が施され、読み取り&書き込み部533によりCD-RW532に記憶される。

#### 【0133】

なお、図14（A）、（B）、（C）において、CPU510、520、530の他に、データ転送制御装置500でのデータ転送制御のためのCPUを別に設けるようにしてもよい。

#### 【0134】

本実施形態のデータ転送制御装置を電子機器に用いれば、USB2.0におけるHSモードでのデータ転送が可能になる。従って、ユーザがパソコン 컴퓨터などによりプリントアウトの指示を行った場合に、少ないタイムラグで印字が完了するようになる。また、スキャナへの画像取り込みの指示の後に、少ないタイムラグで読み取り画像をユーザは見ることができるようになる。また、CD-RWからのデータの読み取りや、CD-RWへのデータの書き込みを高速に行うことができるようになる。

#### 【0135】

また、本実施形態のデータ転送制御装置を電子機器に用いれば、製造コストが安い通常の半導体プロセスでデータ転送制御装置のICを製造できるようになる。従って、データ転送制御装置の低コスト化を図れ、電子機器の低コスト化も図れるようになる。また、データ転送制御の中で高速で動作する部分を少なくすることができるため、データ転送の信頼性を向上でき、電子機器の信頼性も向上できるようになる。

#### 【0136】

なお本実施形態のデータ転送制御装置を適用できる電子機器としては、上記以外にも例えば、種々の光ディスクドライブ（CD-ROM、DVD）、光磁気ディスクドライブ（MO）、ハードディスクドライブ、TV、VTR、ビデオカメ

ラ、オーディオ機器、電話機、プロジェクタ、パーソナルコンピュータ、電子手帳、ワードプロセッサなど種々のものを考えることができる。

## 【0137】

なお、本発明は本実施形態に限定されず、本発明の要旨の範囲内で種々の変形実施が可能である。

## 【0138】

例えば、本発明のデータ転送制御装置の構成は、図1に示す構成に限定されるものではない。

## 【0139】

また、エッジ検出手段（エッジ検出回路）、クロック選択手段（クロック選択回路）の構成も図7に示す構成に限定されるものではない。例えば、エッジ検出手段は、少なくとも、データのエッジを検出し、そのエッジ検出情報をクロック選択手段に出力できるような構成であればよい。

## 【0140】

また、多相クロックの数Nも5個に限定されるものではない。例えば、サンプリングクロック生成回路の製造に使用する半導体プロセスが最新のプロセスである場合には、セットアップタイムTS、ホールドタイムTHも短くできる。従って、この場合には、クロック数Nを5よりも大きくすることができる。

## 【0141】

また、本発明は、USB2.0でのデータ転送に適用されることが特に望ましいが、これに限定されるものではない。例えばUSB2.0と同様の思想に基づく規格やUSB2.0を発展させた規格におけるデータ転送にも本発明は適用できる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図1】

本実施形態のデータ転送制御装置の構成例を示す図である。

## 【図2】

本実施形態のサンプリングクロック生成回路の構成例を示す図である。

## 【図3】

図3 (A)、(B)は、本実施形態の動作について説明するためのタイミング波形図である。

【図4】

H S P L Lの構成例を示す図である。

【図5】

V C Oの構成例を示す図である。

【図6】

図6 (A)、(B)は、反転回路の構成例を示す図である。

【図7】

エッジ検出回路、クロック選択回路の構成例を示す図である。

【図8】

本実施形態の動作について説明するためのタイミング波形図である。

【図9】

本実施形態の動作について説明するためのタイミング波形図である。

【図10】

クロック数Nの設定手法について説明するための図である。

【図11】

図11 (A)、(B)も、クロック数Nの設定手法について説明するための図である。

【図12】

図12 (A)、(B)は、クロックの選択手法 (Mの設定手法) について説明するための図である。

【図13】

エラスティシティバッファの構成例を示す図である。

【図14】

図14 (A)、(B)、(C)は、種々の電子機器の内部ブロック図の例である。

【図15】

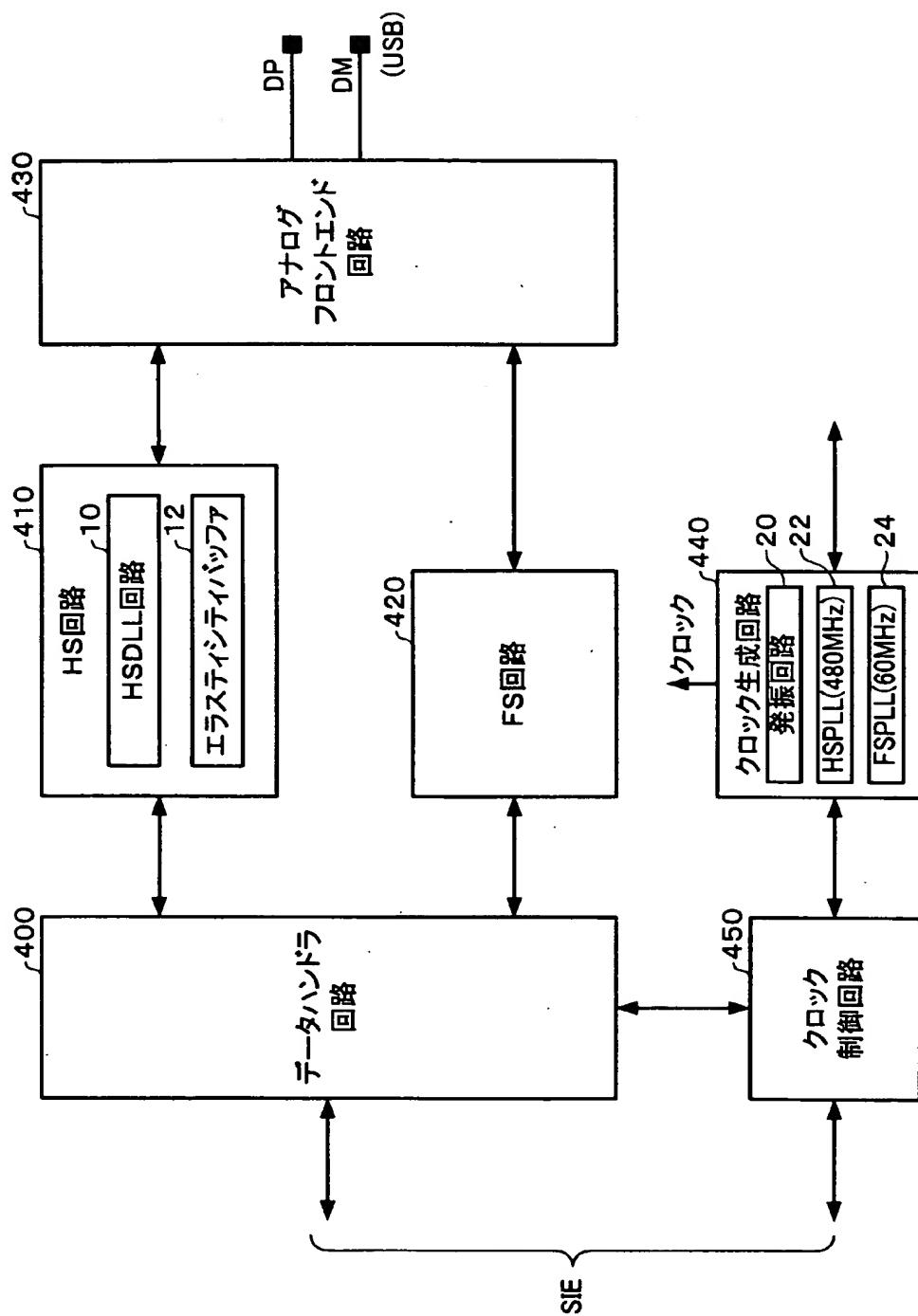
図15 (A)、(B)、(C)は、種々の電子機器の外観図の例である。

## 【符号の説明】

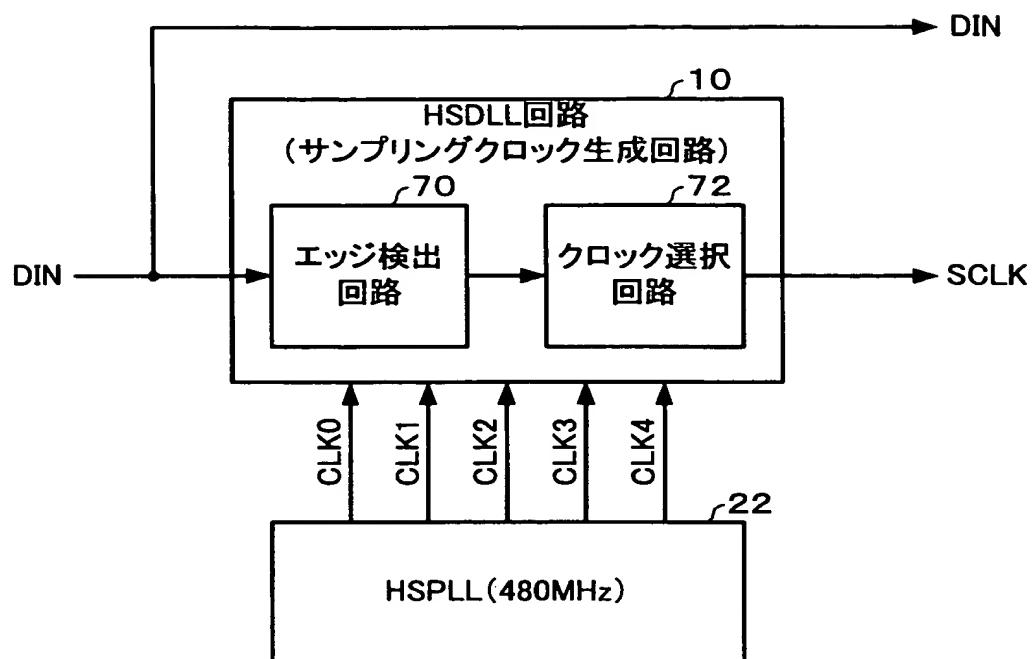
- 1 0 H S D L L回路  
 1 2 エラスティシティバッファ  
 2 0 発振回路  
 2 2 H S P L L  
 2 4 F S P L L  
 5 0 データ保持レジスタ（データ保持手段）  
 5 2 データステータスレジスタ（データステータス保持手段）  
 5 4 書き込みパルス生成回路（書き込みパルス生成手段）  
 6 0 判断回路（判断手段）  
 6 2 ステートマシーン  
 6 4 バッファ  
 6 6 セレクタ（出力手段）  
 7 0 エッジ検出回路（エッジ検出手段）  
 7 2 クロック選択回路（クロック選択手段）  
 8 0 位相比較器  
 8 2 チャージポンプ回路  
 8 4 フィルタ回路  
 8 6 V C O（発振手段）  
 8 8 分周器  
 4 0 0 データハンドラ回路  
 4 1 0 H S回路  
 4 2 0 F S回路  
 4 3 0 アナログフロントエンド回路  
 4 4 0 クロック生成回路  
 4 5 0 クロック制御回路

【書類名】 図面

【図1】

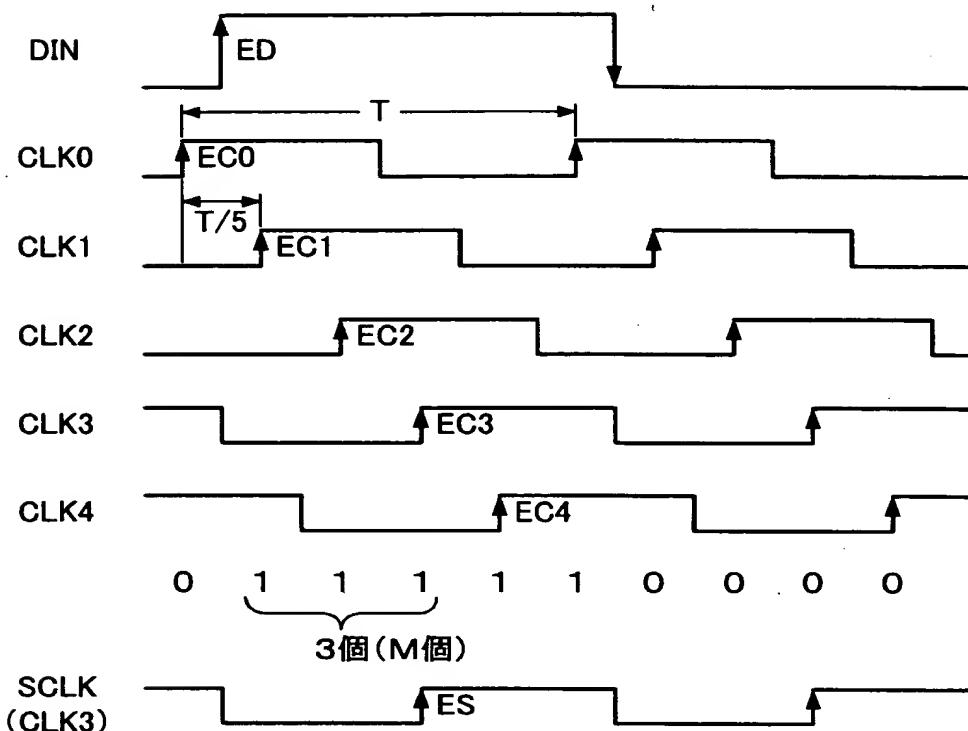


【図2】

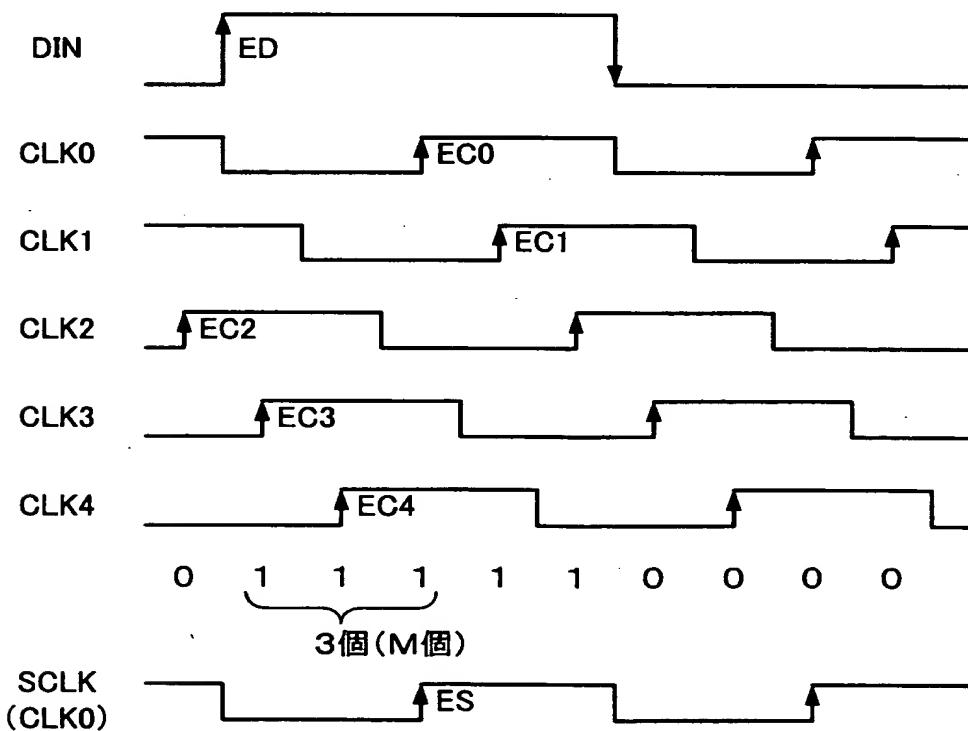


【図3】

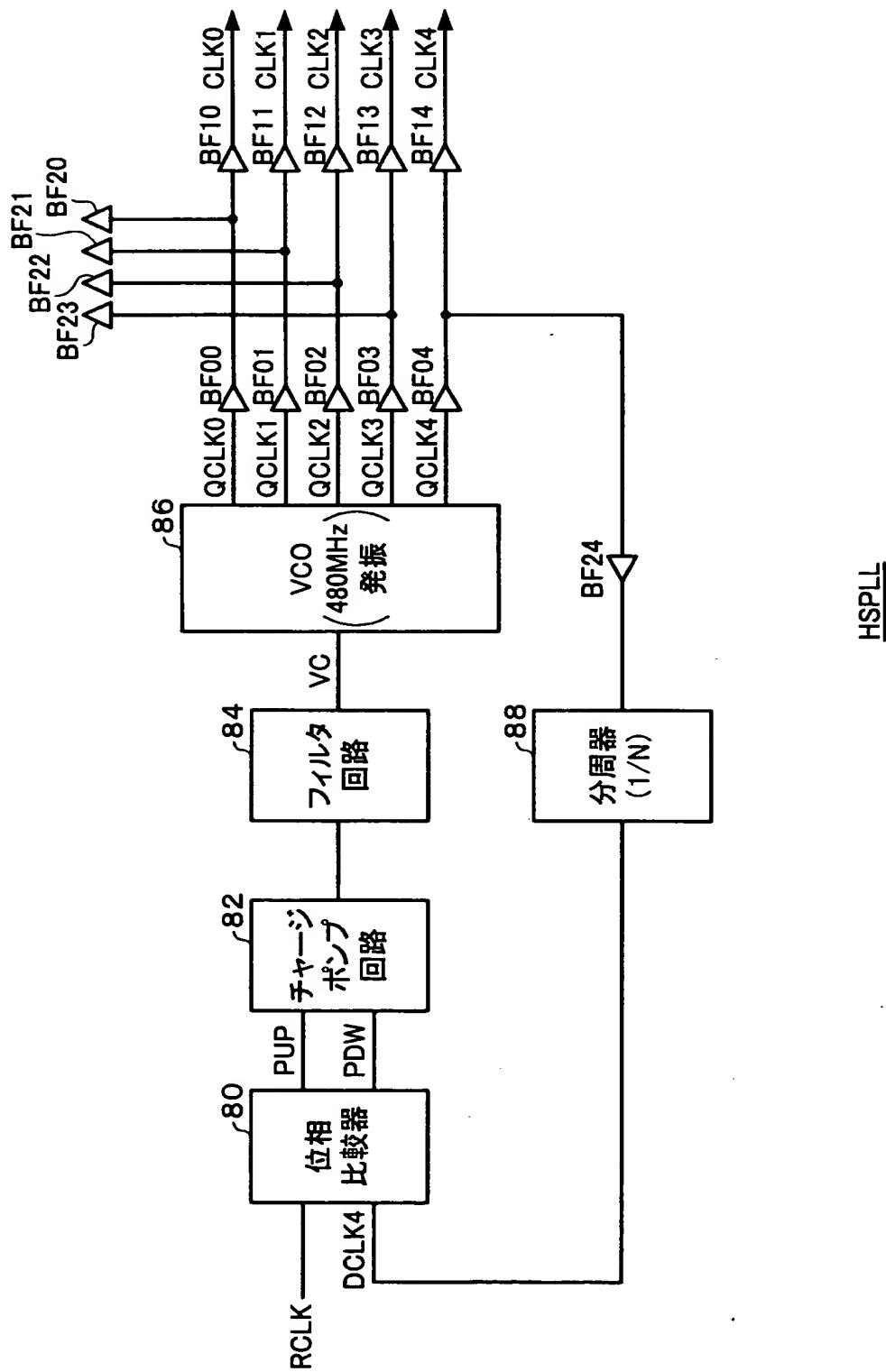
(A)



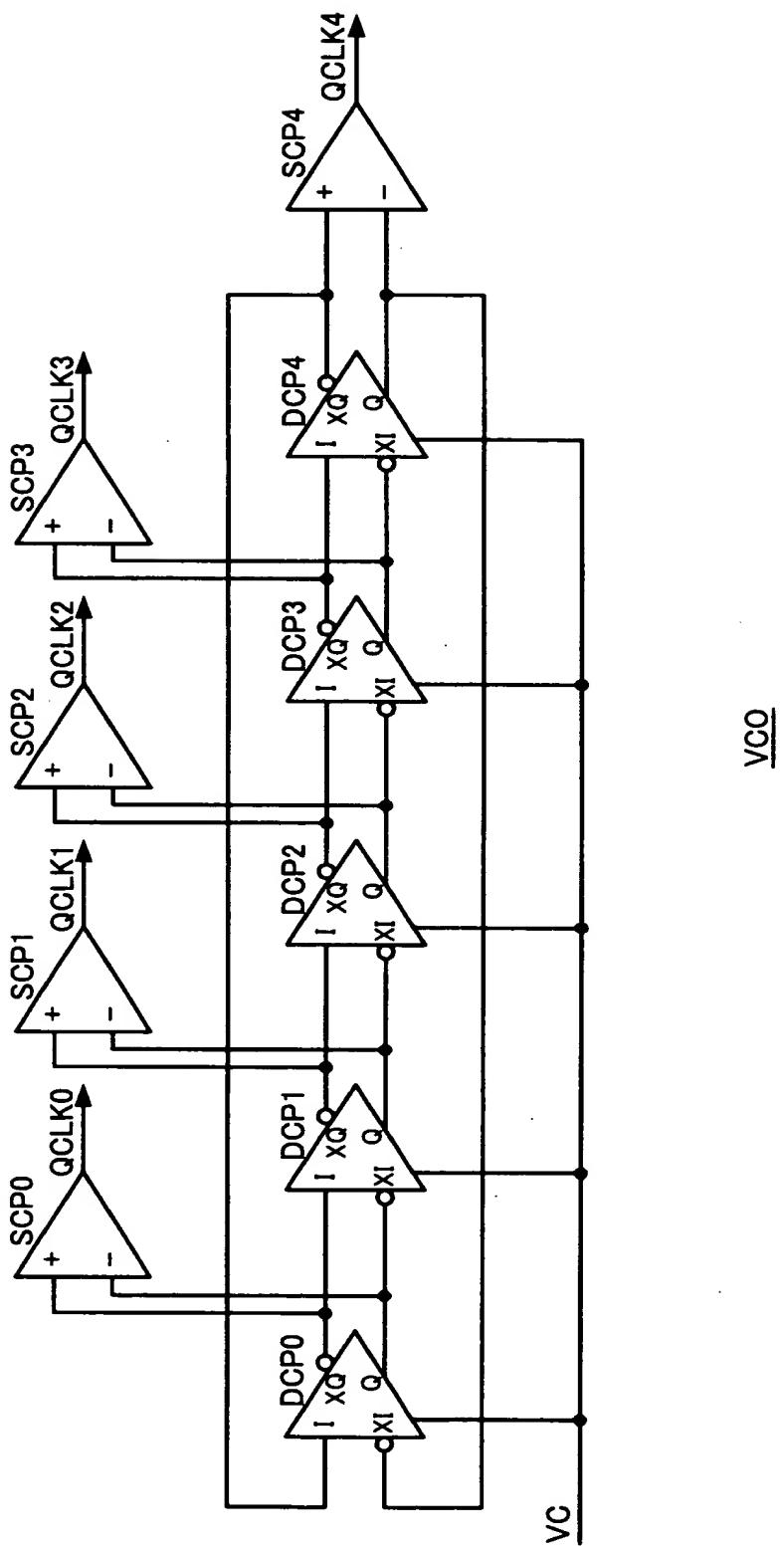
(B)



【図 4】

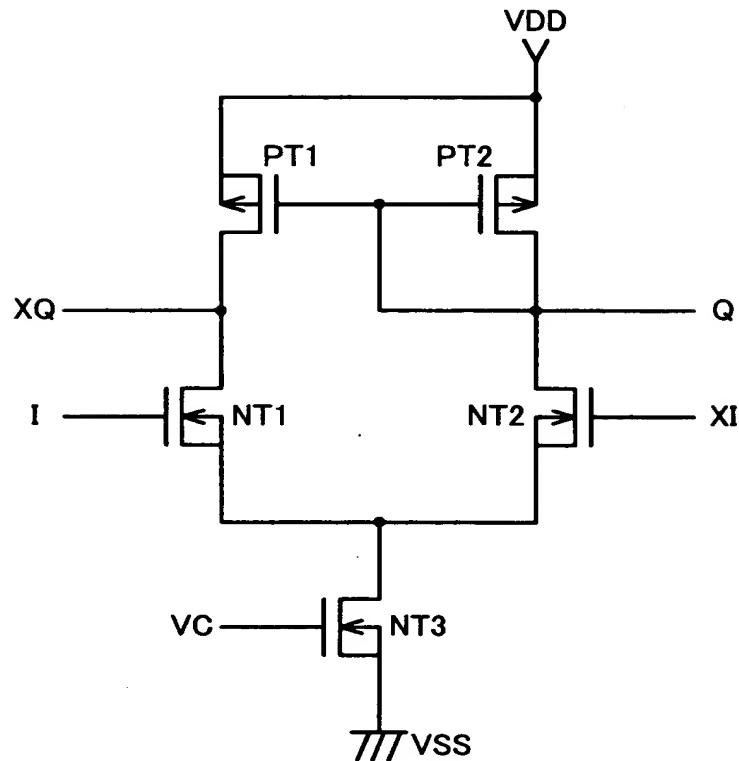


【図5】

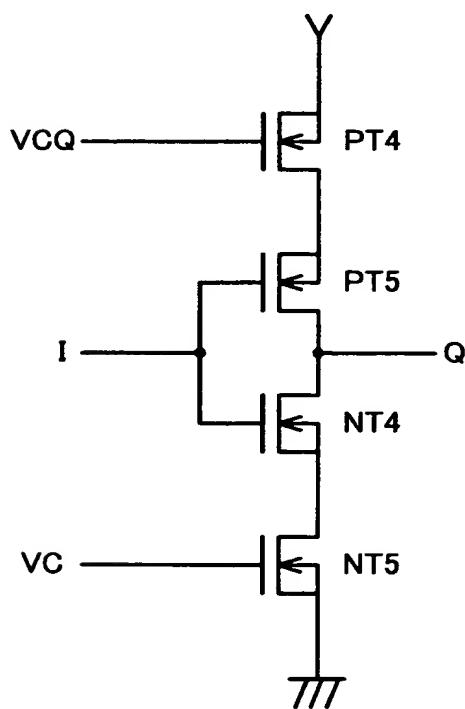


【図6】

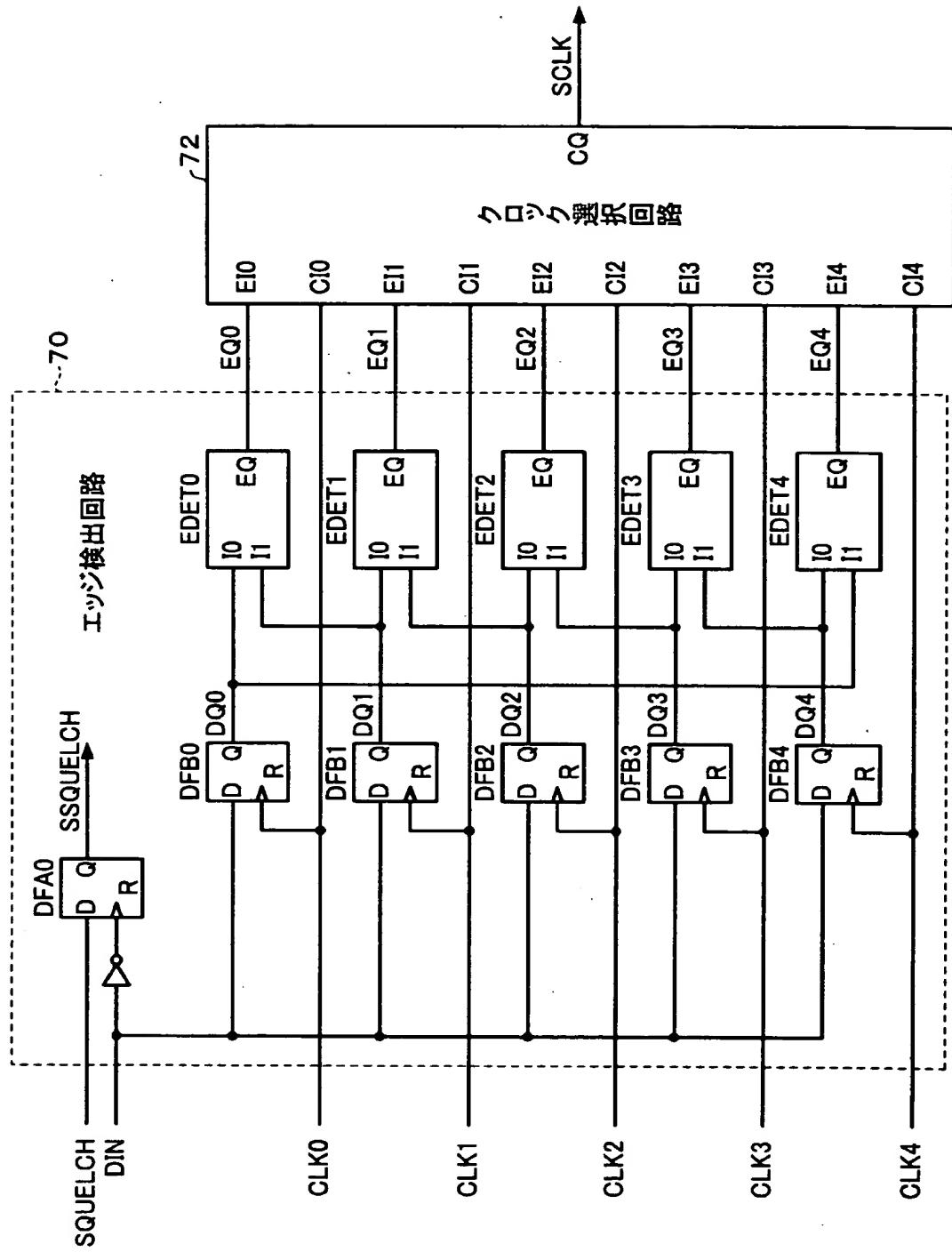
(A)



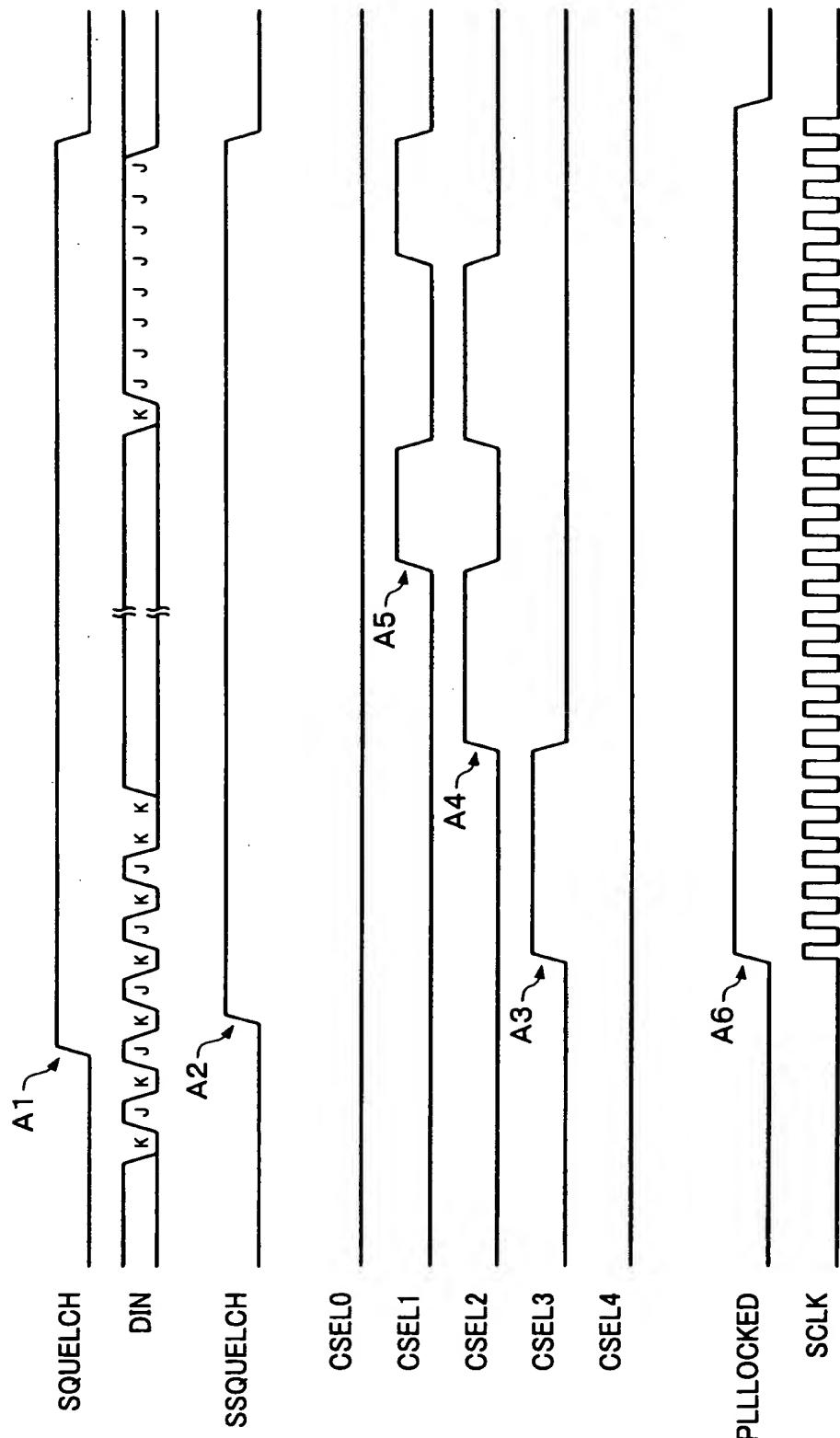
(B)



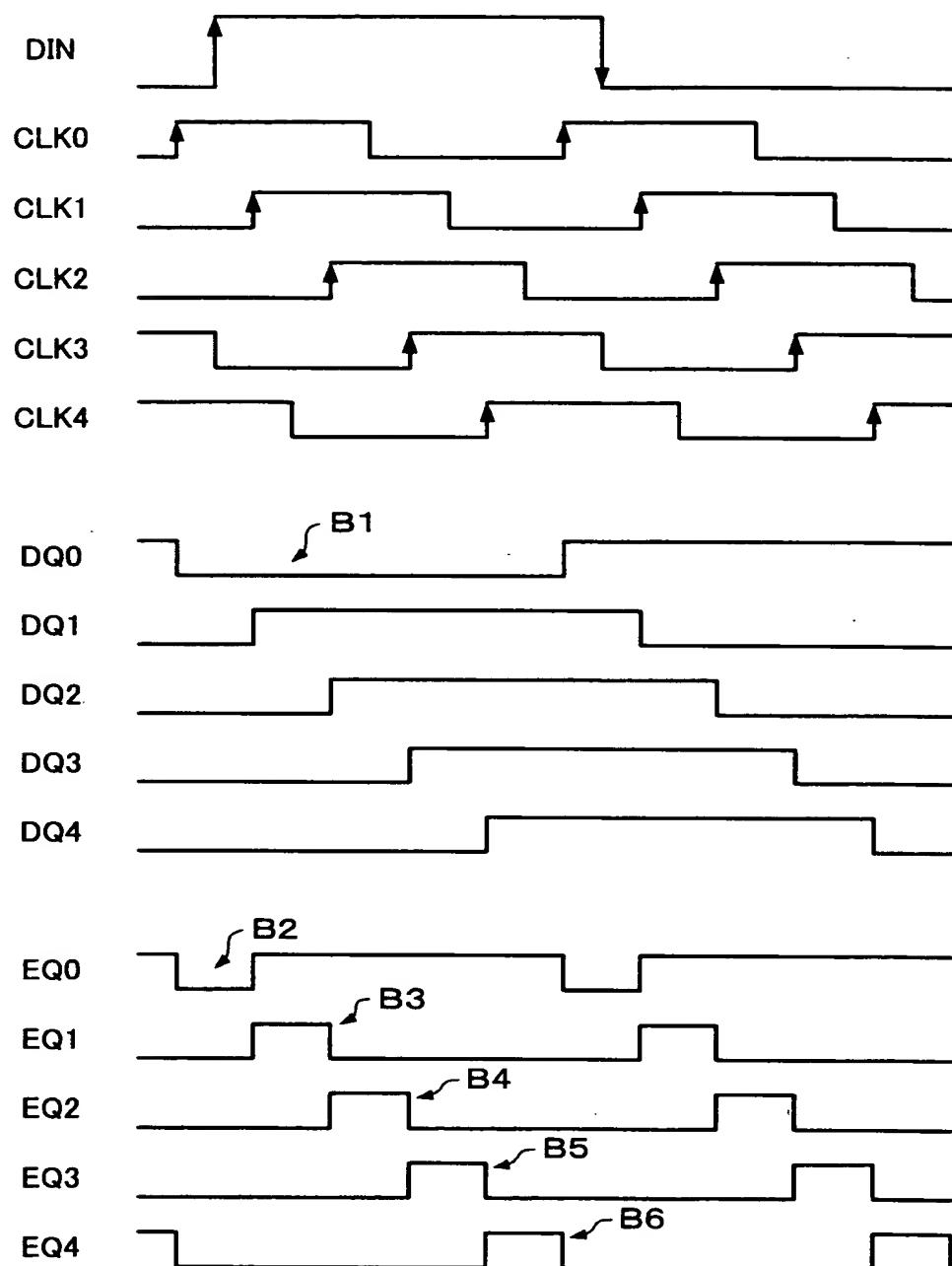
【図7】



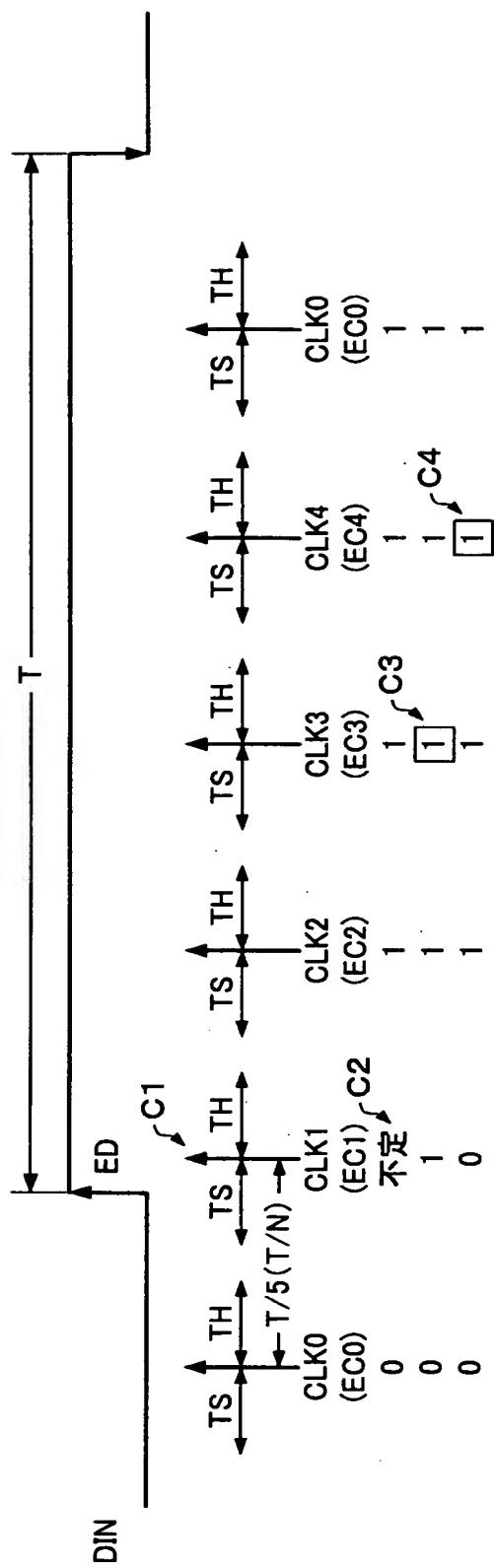
【図8】



【図9】

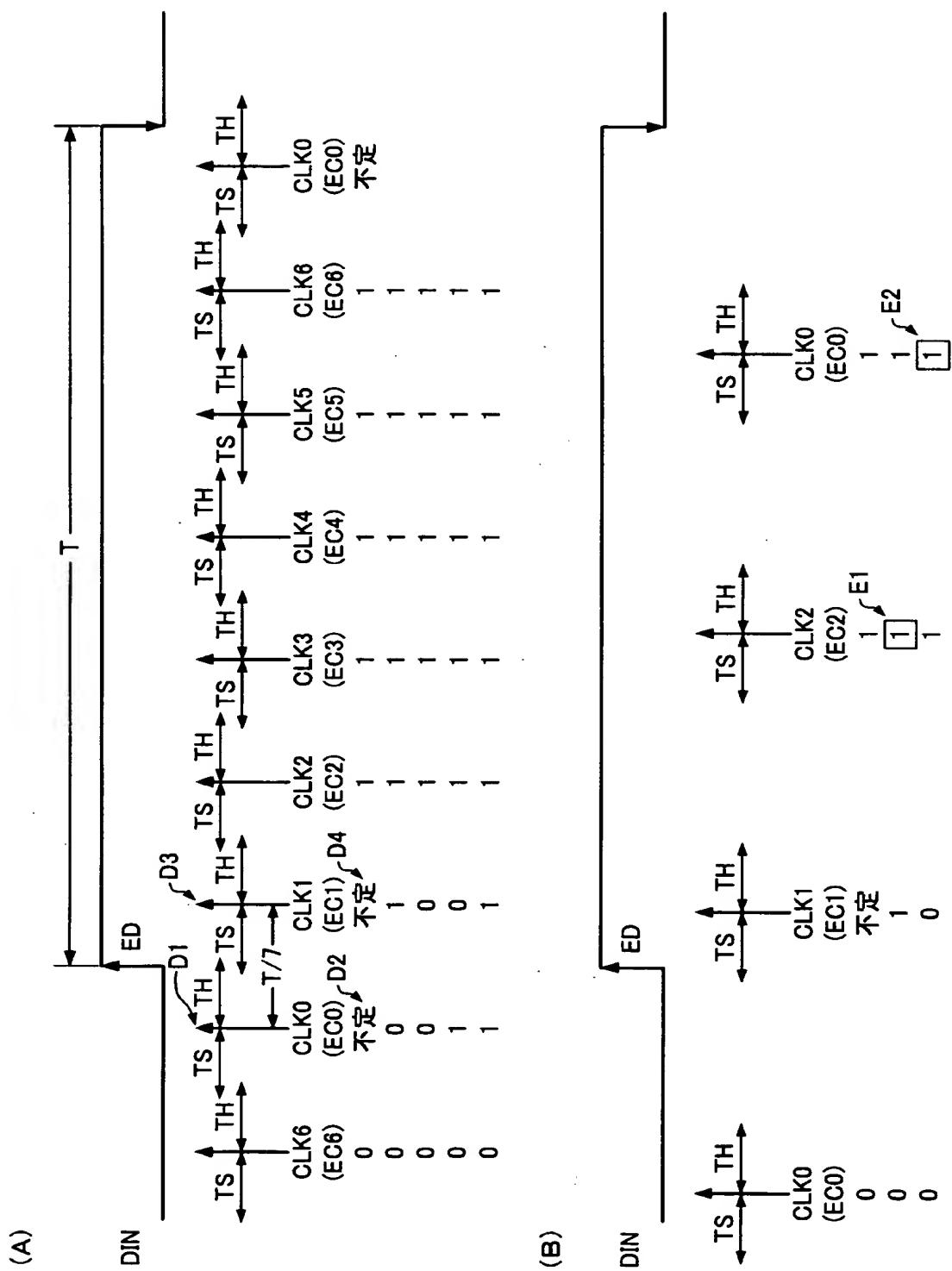


【図10】

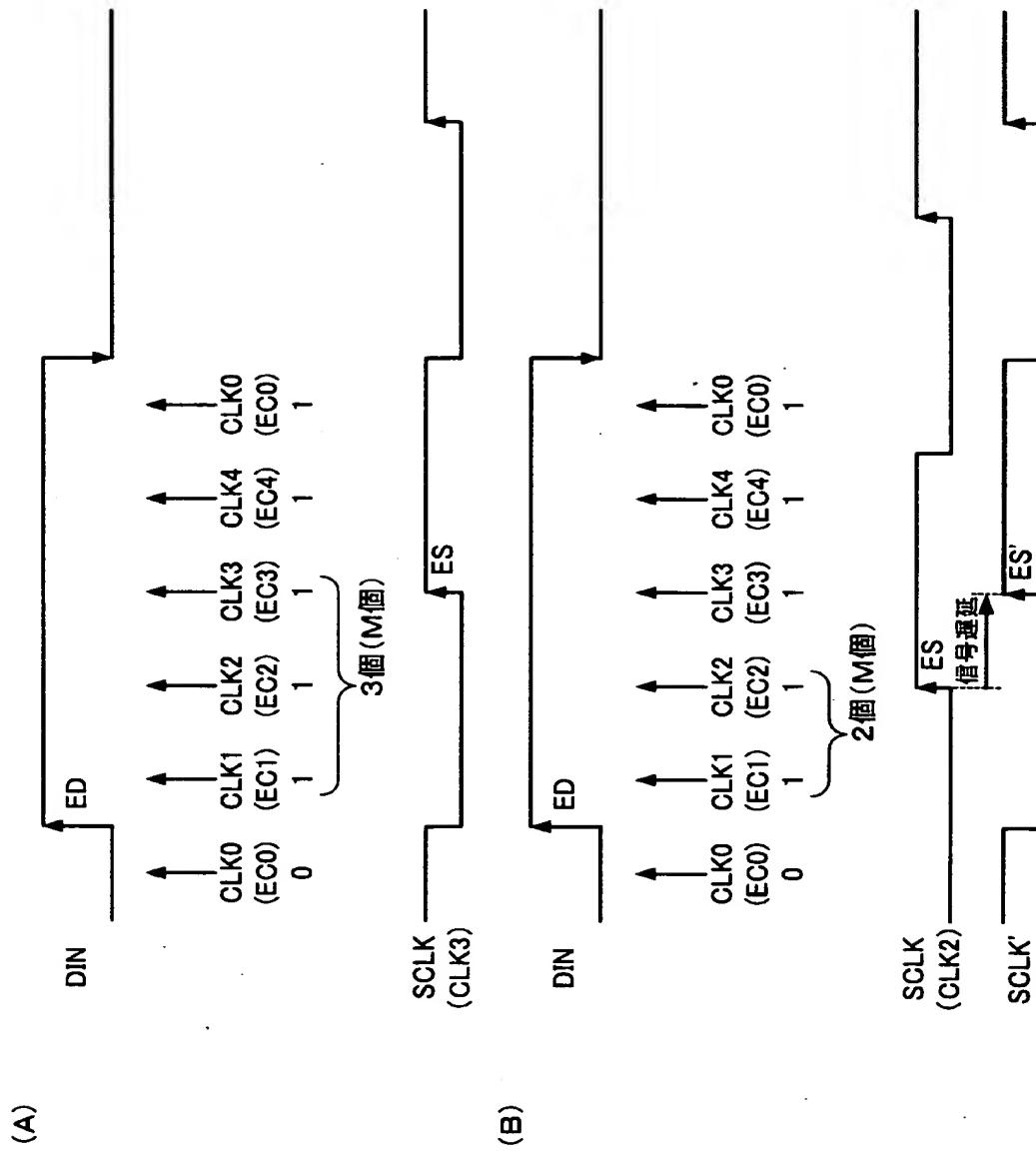


$$\frac{T}{N} > TS + TH \Rightarrow N < \frac{T}{TS + TH} \quad (N \leq \lfloor \frac{T}{TS + TH} \rfloor)$$

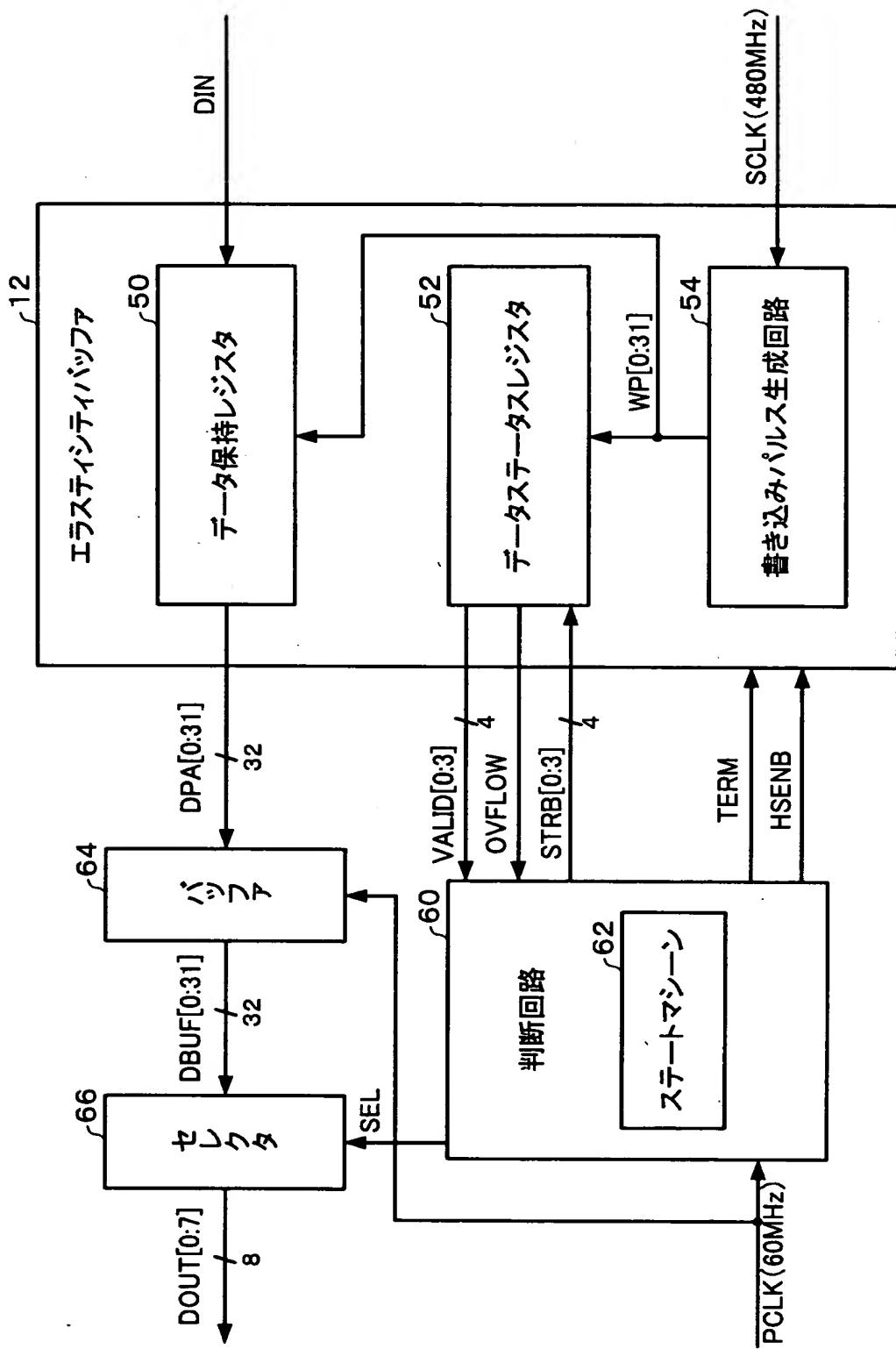
【図11】



【図12】

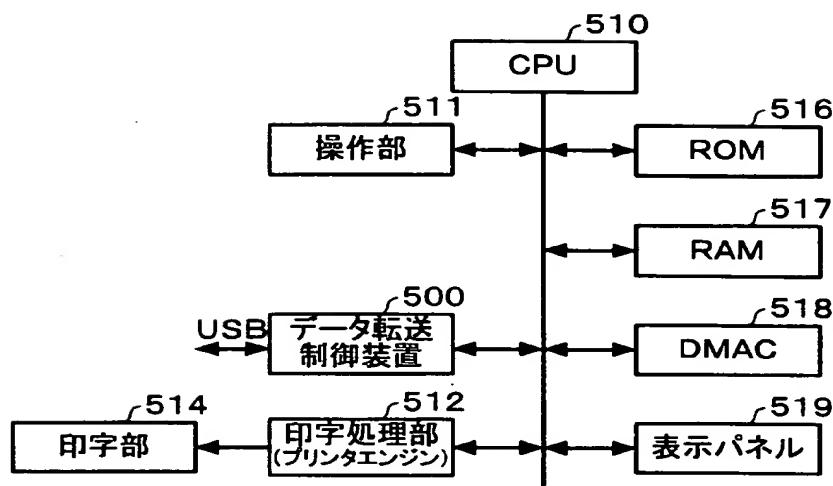


【図13】

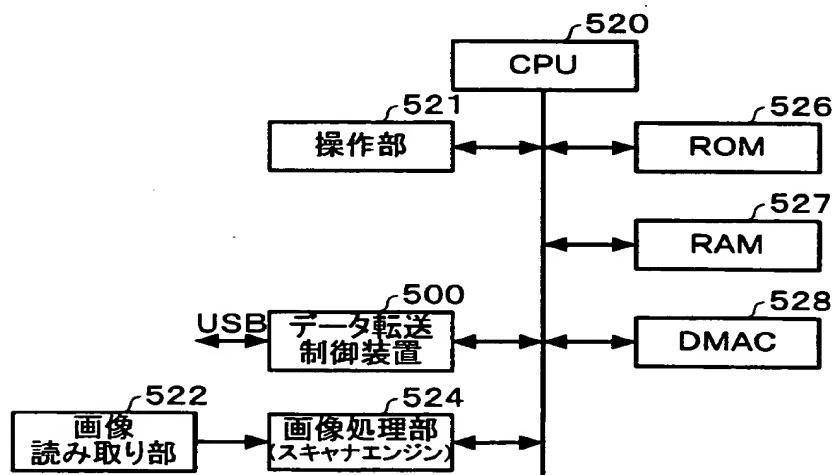


【図14】

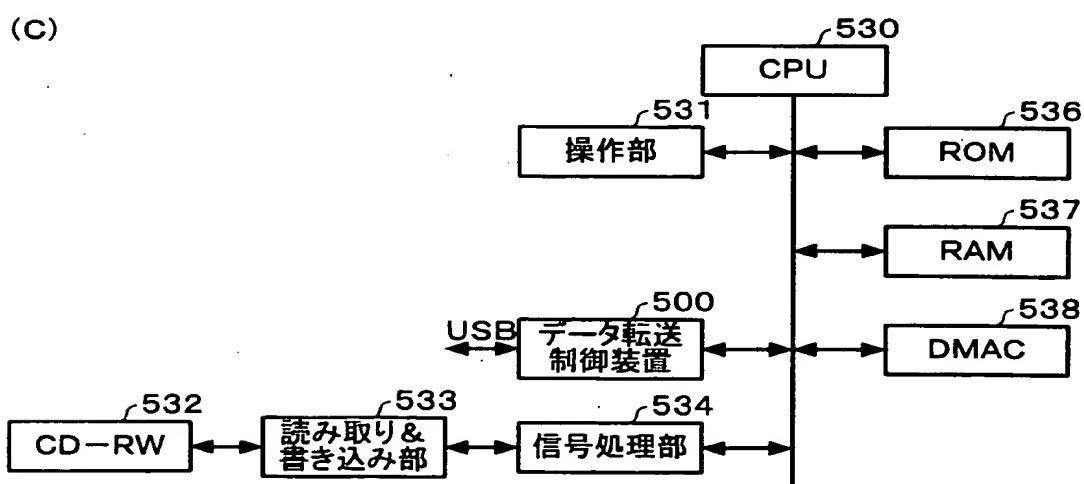
(A)



(B)

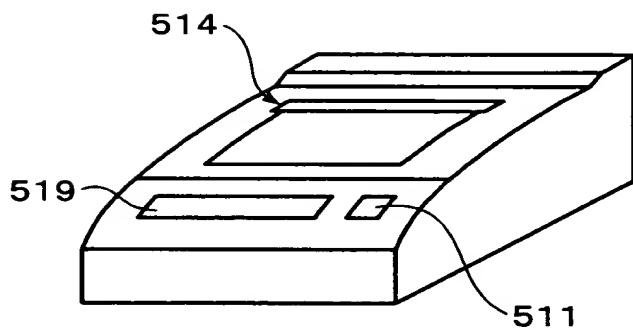


(C)

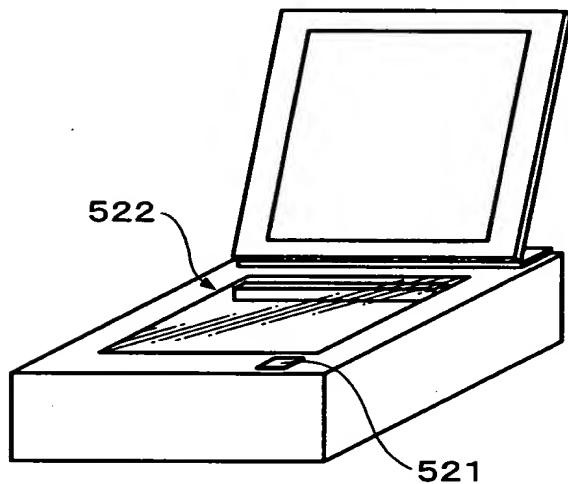


【図15】

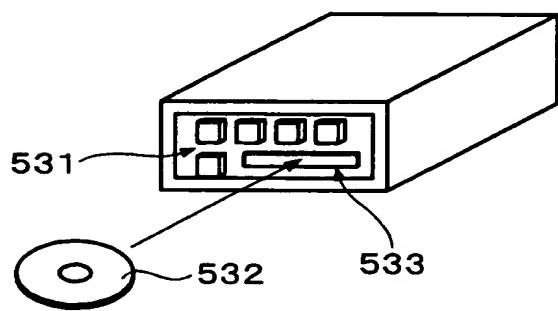
(A)



(B)



(C)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高周波数でありながらサンプリング時でのセットアップタイム等を確保できるサンプリングクロックの生成回路、データ転送制御装置等の提供。

【解決手段】 サンプリングクロック生成回路10は、周波数が同一で位相が互いに異なるクロックCLK0～4のエッジの中のいずれのエッジ間にデータDIN(USB2.0のHSモードで転送されるデータ)のエッジがあるかを検出するエッジ検出回路70と、エッジ検出情報に基づいてCLK0～4の中からいずれかのクロックを選択し、選択したクロックをサンプリングクロックSCLKとして出力するクロック選択回路72を含む。エッジ検出回路70が有するDフリップフロップのセットアップタイムをTS、ホールドタイムをTH、クロックの周期をTとした場合に多相クロックの数Nを $N \leq [T / (TS + TH)]$ ([X]はXを越えない最大の整数)にする。データDINのエッジから設定数Mだけずれたエッジを有するクロックをSCLKとして選択する。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社